

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН

*В.И. Васильева, В.И. Заболоцкий, Н.А. Зайченко,
М.В. Гречкина, Т.С. Ботова, Б.Л. Агапов*

Методами сканирующей электронной микроскопии и атомной силовой микроскопии исследована морфология поверхности ионообменных мембран. Установлены различия в структуре поверхности гомогенных и гетерогенных мембран, исходных коммерческих и образцов после химического кондиционирования, а также подвергшихся эксплуатации при высокоинтенсивных токовых режимах. Определены микро-профили, размер и доля проводящих участков поверхности гетерогенных мембран.